



Pressemeddelelse

EP-TeQ ApS
Lars Kongsted-Jensen
Niels Bohrs Vej 32, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T.: +45 87 48 06 08
F.: +45 87 48 08 06
e-mail: lkj@ep-teq.com



FOR IMMEDIATE RELEASE: august 2008

Göpel Electronic introducerer nyt IEEE 1149.6 kompatibelt JTAG/Boundary Scan I/O test modul

Skanderborg, august 2008, EP-TeQ ApS, leverandør af løsninger til elektronikproduktion, inspektion og test i Norden og de baltiske lande, viser på Elektronik-08 et nyt I/O modul der understøtter IEEE 1149.6 til udvidet JTAG/Boundary Scan test fra Göpel Electronic GmbH.

Modulet hedder CION Module™/FXT114S og er et nyt low-cost modul, som styres via en standard Test Access Port (TAP). Modulet råder over 114 parallelle I/O kanaler som understøtter IEEE 1149.1, hvoraf de 50 også understøtter IEEE 1149.6 til strukturel test af højhastigheds differentielle snitflader. Med den fysiske lille dimension kan modulet let integreres i test fixturer/adaptore.

"Med dette nye I/O modul adresserer vi det stigende behov for understøtning af strukturel test af avancerede digitale netværk med IEEE 1149.6 funktionalitet" siger Raj Puri, Vice President Marketing and Sales for Göpel Electronic i USA. "Kombinationen af IEEE 1149.1 og IEEE 1149.6 I/O mulighederne på et enkelt modul til integration i test adaptore, sikrer vores kunder et low-cost alternativ til udvidelse af deres strukturelle test af højhastigheds net på printkort i deres produktion".

CION Module™/FXT114S har 64 single-ended test kanaler styret af Göpel's CION™ ASIC kredse. Alle kanaler kan uafhængigt styres til Input/Output/Tri-state, og output spændingen kan programmeres mellem 1.8V og 5.0V i grupper af 32. Hver kanal kan også yde en høj strøm og har en speciel sikkerhedsanordning der kaldes en un-stress feature, der beskytter testemnet mod yderligere skade i tilfælde af fejl. Udover de 64 single-ended I/O kanaler er der så også 50 differentielle I/Os med IEEE 1149.6 support. De differentielle kanaler er konfigureret som 25 inputs og 25 outputs. Hvis der er behov for flere kanaler, kan flere moduler let kobles i kæde via deres TAP interface. Disse muligheder gør modulet særdeles velegnet til test af non-Bscan clusters, perifere stik, backplanes og AC-koblede netværk i mange typer applikationer.

Det nye CION™ modul er fuldt understøttet af den integrerede JTAG/Boundary Scan software platform SYSTEM CASCON™, og det kan bruges sammen med en hvilken som helst ScanBooster™ og SCANFLEX Boundary Scan controller. SYSTEM CASCON™ er et innovativt udviklingsmiljø til IEEE 1149.x applikationer og inkluderer mere end 38 fuldt integrerede værktøjer. Brugere kan på enkel vis inkludere CION Module™/FXT114S i et testprojekt, generere de ønskede test vektorer fuldautomatisk med ATPG værktøj, der understøtter både IEEE 1149.1 og IEEE 1149.6, og få en detaljeret diagnose som resultat i tilfælde af en fejl under test afviklingen. Fundne fejl visualiseres på pin og net niveau.

Om Göpel Electronic og EP-TeQ

Göpel Electronic grundlagt i Jena, Tyskland i 1991 er en verdens omspændende ledende leverandør af innovative JTAG/Boundary Scan/IEEE1149.x løsninger, og tilbyder gennemprøvede software værktøjer i et integreret udviklingsmiljø samt højt ydende Bscan Controllere og tilbehør såvel som omfattende produkt support og konsulent ydelser. De mere end 130 ansatte skabte i 2007 en omsætning på over 18.5 millioner euro og har kontorer i Tyskland, Frankrig, England og USA. Distributionsnettet der omfatter over 300 specialister verden over sikrer en fortræffelig support af de mere end 5.600 installerede systemer. Göpel har været ISO9001 certificeret siden 1996.

For EP-TeQ er det vigtigt, at forstå kundernes situation, krav og ønsker samt at deltage i definitionen af en opgave. Herved sikrer de sig at kunne levere til tiden og evaluere den endelige ydelse op mod specifikationen efter implementering. Opgaverne er selvfølgelig ikke løst før EP-TeQ og deres leverandører har sikret optimal driftssikkerhed i den løbende produktion.